

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
РАЗРЯДА СТРУКТУР Si-SiO₂
МЕТОДОМ ЗОНДА КЕЛЬВИНА**

Бутусов И.Ю., Татохин Е.А., Тутов Е.А.

Рассмотрено применение метода зонда Кельвина для исследования электрического разряда структур Si-SiO₂. Разработан метод анализа результатов измерений. Проведено исследование и определены значения электрических параметров двух окисленных кремниевых пластин.